



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 22092—2008

---

## 电子数显测微头和深度千分尺

Fixed micrometer and depth micrometer with electronic digital display

2008-06-25 发布

2009-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国量具量仪标准化技术委员会(SAC/TC 132)归口。

本标准负责起草单位:苏州麦克龙测量技术有限公司。

本标准参加起草单位:成都工具研究所。

本标准主要起草人:黄晓宾、张洪玲、姜志刚。

# 电子数显测微头和深度千分尺

## 1 范围

本标准规定了电子数显测微头和深度千分尺的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分辨力高于或等于 0.001 mm, 量程小于或等于 30 mm 的电子数显测微头和深度千分尺。量程等于 50 mm 的电子数显测微头和深度千分尺参见附录 A。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1216—2004 外径千分尺

GB/T 2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验 (IEC 60068-2-78:2001, IDT)

GB/T 2423.22—2002 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 N:温度变化 (IEC 60068-2-14:1984, IDT)

GB 4208—2008 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 17163 几何量测量器具术语 基本术语

GB/T 17164 几何量测量器具术语 产品术语

GB/T 17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(IEC 61000-4-2:2001, IDT)

GB/T 17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC 61000-4-3:2002, IDT)

## 3 术语和定义

GB/T 17163 和 GB/T 17164 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**电子数显千分尺数显装置** **electronic digital indicating devices for micrometer**

利用角度传感器、电子和数字显示技术,计算并显示电子数显千分尺的螺旋副位移的装置。以下简称“电子数显装置”。

### 3.2

**最大允许误差(MPE)** **maximum permissible error**

由技术规范、规则等对电子数显测微头和深度千分尺规定的误差极限值。

### 3.3

**浮动零位** **floating zero**

在测量范围内任意位置设定零位。